

## A-004 電界放出形走査電子顕微鏡 (EDX付) (FE-SEM) (日立ハイテクノロジーズ : SU8010)

冷陰極電界放出形電子銃を用いた走査型電子顕微鏡です。電子ビームを細く収束させることができるため超高倍率の表面構造観察が可能です。  
エネルギー分散型X線分析装置 (EDX) により、観察試料の元素分析が可能です。



### 【仕様】

本体	Hitachi SU8010
二次電子分解能	1.0nm(加速電圧15kV)、1.3nm(加速電圧1kV)
倍率	20~2000倍 (低倍率モード) 、100~80万倍 (高倍率モード)
加速電圧 (Vacc)	0.5~300 kV
検出器	二次電子検出器 (Upper-Lower検出器二台)
エネルギー分散型 X線分析装置	ブルカー Quantax200
種類	シリコンドリフト検出器
有効面積	10mm <sup>2</sup>
検出元素	B~U
エネルギー分解能	MnKa半値幅で129eV以下
冷却	電子冷却 (液体窒素, 冷却水不要)
マグネトロンスパッタ 装置	真空デバイス MSP-1S
標準ターゲット	Pt

設置場所 C10棟 114室

カテゴリ 観察